官報告示

産業

日本産業規格

令和７年８月20日に下記の日本産業規格を制定、改正及び廃止したので、産業標準化法（昭和24年法律第185号）第19条の規定に基づき公示する。

令和７年８月20日　　経済産業大臣　武藤　容治

記

制定された日本産業規格

（日本産業標準調査会審議）

工作機械―環境評価―第４部：鍛圧機械及びレーザ加工機のエネルギー効率に関する試験の原則	Ｂ0955―４

（認定機関　一般財団法人　日本規格協会　申出）

火災危険性試験―電気・電子―第１―12部：電気・電子製品の火災危険性評価指針―火災安全工学	Ｃ60695―１―12
火災危険性試験―電気・電子―第１―20部：電気・電子製品の火災危険性評価指針―着火性―一般指針	Ｃ60695―１―20
光ファイバセンサ―第２－２部：温度測定―分布型センシング	Ｃ61757―２―２
製品の加速試験方法	Ｃ62506
情報技術―人工知能―マネジメントシステム	Ｑ42001
情報技術―用語―バイオメトリクス	Ｘ0037
トラストワージネス―用語	Ｘ0061
汎用情報配線設備―第４部：単独居住者用住宅	Ｘ5150―４
汎用情報配線設備―第５部：データセンター	Ｘ5150―５
モノのインターネット（IoT）及びデジタルツイン―用語	Ｘ20924

改正された日本産業規格

（日本産業標準調査会審議）

工作機械試験方法通則―第10部：数値制御工作機械に取り付けたプロービングシステムの測定性能評価方法	Ｂ6190―10
模型によるポンプ性能試験方法	Ｂ8327
レーザ製品の安全―クラス分け及び要求事項	Ｃ6802
太陽光発電用語	Ｃ8960
地上設置の太陽電池（ＰＶ）モジュール―設計適格性確認及び型式認証―第１部：試験要求事項	Ｃ61215―１
地上設置の太陽電池（ＰＶ）モジュール―設計適格性確認及び型式認証―第１－１部：結晶シリコン太陽電池（ＰＶ）モジュールの試験に関する特別要求事項	Ｃ61215―１－１
地上設置の太陽電池（ＰＶ）モジュール―設計適格性確認及び型式認証―第１－２部：薄膜テルル化カドミウム（CdTe）太陽電池（ＰＶ）モジュールの試験に関する特別要求事項	Ｃ61215―１－２
地上設置の太陽電池（ＰＶ）モジュール―設計適格性確認及び型式認証―第１－３部：薄膜非晶質系シリコン太陽電池（ＰＶ）モジュールの試験に関する特別要求事項	Ｃ61215―１－３
地上設置の太陽電池（ＰＶ）モジュール―設計適格性確認及び型式認証―第１－４部：薄膜ＣＩＳ系太陽電池（ＰＶ）モジュールの試験に関する特別要求事項	Ｃ61215―１－４
地上設置の太陽電池（ＰＶ）モジュール―設計適格性確認及び型式認証―第２部：試験方法	Ｃ61215―２
ファシリティマネジメント―マネジメントシステム―要求事項及び利用の手引	Ｑ41001
光学及びフォトニクス―光学材料及び部品―レーザ干渉法による光学ガラスの均質度の測定方法	Ｒ3252

（認定機関　一般財団法人　日本規格協会　申出）

電子機器用固定コンデンサ―第11部：品種別通則：固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属はく直流コンデンサ	Ｃ5101―11
電子機器用固定抵抗器―第８部：品種別通則：表面実装用固定抵抗器	Ｃ5201―８
電子機器用可変抵抗器―第３部：品種別通則：回転形精密級可変抵抗器	Ｃ5260―３
電気・電子機器用コネクタ―試験及び測定―第１―100部：一般―ＪＩＳＣ　5402規格群一覧	Ｃ5402―１―100
電気・電子機器用コネクタ―試験及び測定―第23―３部：スクリーニング及びフィルタリング試験―試験23ｃ：コネクタ及びアクセサリのシールド効果	Ｃ5402―23―３
光ファイバ形分散補償器	Ｃ5916―３
光増幅器―測定方法―第３－２部：雑音指数パラメータ―電気スペクトラムアナライザ試験方法	Ｃ6122―３－２
光増幅器―測定方法―第４－１部：過渡パラメータ―二波長法を用いた利得パラメータ測定	Ｃ6122―４－１
光増幅器―測定方法―第４－３部：過渡パラメータ―パワー制御単一チャネル光増幅器のパワーパラメータ測定	Ｃ6122―４－３
環境試験方法―電気・電子―第２―14部：温度変化試験方法（試験記号：Ｎ）	Ｃ60068―２―14
環境試験方法―電気・電子―第２―17部：封止（気密性）試験方法（試験記号：Ｑ）	Ｃ60068―２―17
環境試験方法―電気・電子―第３－４部：支援文書及び指針―高温高湿試験	Ｃ60068―３－４
環境条件の分類―第３－４部：環境パラメータ及びその厳しさのグループ別分類―屋外固定使用の条件	Ｃ60721―３－４
情報技術―サービスマネジメント―第１部：サービスマネジメントシステム要求事項	Ｑ20000―１
セキュリティ及びレジリエンス―事業継続マネジメントシステム―要求事項	Ｑ22301
システム及びソフトウェア技術―システムライフサイクルプロセス	Ｘ0170
カード及び個人識別用セキュリティデバイス―試験方法―第１部：一般的特性	Ｘ6305―１

（内容省略）

備考　内容は、日本産業標準調査会ホームページ（https://www.jisc.go.jp）において閲覧に供する。また、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課、各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局経済産業部においても閲覧に供する。

廃止された日本産業規格

（認定機関　一般財団法人　日本規格協会　申出）

集積回路用語	Ｃ5610
環境試験方法―電気・電子―大気腐食に対する加速試験―指針	Ｃ60355
環境試験方法（電気・電子）ヒータによる不完全接続耐火性試験方法	Ｃ60695―２－３
静電気―第３－２部：静電気の影響をシミュレーションする方法―マシンモデル（ＭＭ）の静電気放電試験波形	Ｃ61340―３－２
図書館相互貸借応用のサービス定義	Ｘ0808
図書館相互貸借応用のプロトコル仕様―第１部：プロトコル仕様	Ｘ0809
トピックマップ―第４部：正準化	Ｘ4157―４
ＸＭＬ文書へのグリフ識別子の埋込み	Ｘ4166
近距離通信ワイヤード　インタフェース（ＮＦＣ―ＷＩ）	Ｘ5215
印刷工程管理のためのデータベース構造モデル及び制御パラメタの符号化―第１部：構造モデル及びデータベース記述書式	Ｘ9206―１